PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-216440

(43) Date of publication of application: 06.08.1992

(51)Int.CI.

G01N 21/01

G01N 21/63

(21)Application number: 03-050219

(71)Applicant: AMERICAN CYANAMID CO

(22)Date of filing:

25.02.1991

(72)Inventor: POPIELSKI STANLEY E

HOLDSWORTH MELVYN

(30)Priority

Priority number : 90 485409

Priority date : 27.02.1990

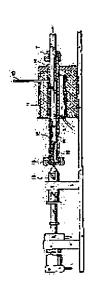
Priority country: US

(54) APPARATUS AND METHOD FOR INJECTING COMPOUND INTO PLASMA FOR INDUCTION COUPLING TYPE ARGON PLASMA EMISSION SPECTROSCOPIC ANALYSIS

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve means and method for introducing vaporized analysis sample of liquid compound into plasma.

CONSTITUTION: A heating tube 10 penetrating a heating block 11 to be heated by an electric resistance type heating rod 12 is provided in an argon heating sample injector, and the outer end is closed by a partition cap 13. A sample supply tube 14 is continued to a plasma torch at the inside of the tube 10. An annular channel is formed as an argon channel between the tubes 10 and 14. An argon supply tube 15 is coupled to the interior of the tube near the end of the tube 10. The other end of the tube is coupled to an annular fixture 16. the tube 14 is held at the correct position, and the annular channel between both the tubes is sealed. A sample syringe 18 having an injection needle 19 is pierced through the cap 13 into the open end of the tube 14, and the small bundle of liquid scatter preventing wool or metal fiber is placed at the end of the needle.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) [[本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平4-216440

(43)公開日 平成4年(1992)8月6日

(51) Int.Cl.5	識別記号	· 庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G 0 1 N 21/01	· z	7370-2 J		
21/63	Z	7621-2 J		

審査請求 未請求 請求項の数2(全 6 頁)

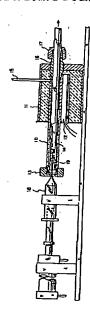
(21)出願番号	特願平3-50219	(71)出願人	591000791
(22) 出願日	平成3年(1991)2月25日		アメリカン・サイアナミド・カンパニー AMERICAN CYANAMID C
(31)優先権主張番	、 長 48540g		OMPANY
	1990年 2 月27日		アメリカ合衆国ニュージヤージイ州07470 ウエイン・ワンサイアナミドプラザ (番地
(33) 優先権主張国	米国 (US)		なし)
		(72)発明者	スタンレイ・イー・ボビールスキ
			アメリカ合衆国コネチカツト州06333イー
			ストライム・デイーンロード83
		(72)発明者	メルピン・ホルズワース
			アメリカ合衆国コネチカツト州06430フエ
			アフイールド・メイフエアロード79
		(74)代理人	弁理士 小田島 平吉

(54) 【発明の名称】 誘導結合型アルゴンプラズマ発光分光分析用プラズマ内に化合物を噴射させる装置及び方法

(57)【要約】 (修正有)

【目的】液体化合物の気化分析試料をプラズマ中に導く 手段、方法の改良。

【構成】アルゴン加熱及び試料噴射装置に、電気抵抗式の加熱用ロッド12で加熱される加熱用ブロック11を買通する加熱管10を設け、隔壁キャップ13でその外側端部を閉鎖する。加熱管10の内側で、試料供給管14がプラズマトーチまで連続する。管10,14間はアルゴン流路用として環状流路を形成する。アルゴン供給管15を加熱管10の端部近くで加熱管内部に連結する。加熱管の他端は環状の取り付け具16に連結され、供給管14を正しい位置に保持しかつ両管の間の環状の流路の端部を密閉する。噴射針19を備えた試料注入器1.8が隔壁キャップ13を通り供給管14の閉口端に入り、針の端部に液の飛散防止用のウール又は金属級維等の小さな束を置く。



(2)

特開平4-216440

【特許謝求の範囲】

【請求項1】揮発性有機金属化合物内の金属不純物を検 出し測定する誘導結合型アルゴンプラズマ発光分光の手 段による前記化合物の分析において、

- a) 分光計の誘導結合型アルゴンプラズマにアルゴン流 を連続的に供給し、
- b) 前記アルゴン流がプラズマに達するより以前に、分 析すべき有機金属化合物の気化した試料を流れの中で運 ぶに十分な温度にこれを加熱し、
- けているときに、分析すべき化合物の液体試料を加熱さ れたアルゴン流内に直接噴射し、
- d) アルゴン流がプラズマに達するより前に加熱され流 れているアルゴン流内で噴射された試料を気化させ、
- e) 気化試料を分析用プラズマに直接運ぶ加熱アルゴン 流の流れを連続することを包含した改良。

【請求項2】光源としての誘導結合型高周波プラズマ及 び分析すべき揮発性液体化合物の気化試料をプラズマ内 に導く手段を備えた誘導結合型アルゴンプラズマ発光分 光装置にして、前記手段が

- a) 前記プラズマ内にアルゴンの連続流を流すための手 EG.
- b) 前記アルゴンの流れがプラズマに達するより前に前 記流れを加熱するための手段、
- c) 揮発性液体の試料を加熱アルゴン流内に連続的に噴 射するための手段、及び
- d) アルゴン流がプラズマに達するより前に前記液体を 前記アルゴン流内に気化させる手段を具備した装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】本発明は誘導結合型アルゴンプラズマ発光 30 分光法の改良に関し、特に誘導結合型アルゴンプラズマ 発光分光法による微量金属の検出のための電子級 (elec tronic grade) 有機金属化合物に分析に関する。

【0002】半導体製造に使用されるような化合物の製 造の品質管理においては、電子級有機化合物におけるご く少量の不純物の検出が重要である。誘導結合型アルゴ ンプラズマ発光分光法は、この用途に対する特に有用な 分析装置を持っている。この分光計は、製品中の濃度1 ppm未満の多くの金属不純物を検出し測定できる。 検査 計の誘導結合型アルゴンプラズマのベースに導かれる。 アルゴンの連続流により液体試料の蒸気又はエアロゾル がプラズマ内に運ばれ、ここで試料が還元され、試料中 の金属分子は特有の波長を持った放射を出し、その強度 は分光計により検出され測定される。誘導結合型アルゴ ンプラズマ発光分光法の使用は公知の分析技術である。

【0003】本発明は分析すべき液体化合物の気化した 試料をプラズマ中に導く新規な手段及び方法を提供す る。更に、本発明は、分光計の校正の目的で、測定され た量の試料化合物の蒸気と混合された測定された量の金 50 ないであろう。

2 腐含有不純物の蒸気をプラズマに導く手段を提供する。

【0004】従来の技術においては、誘導結合型アルゴ ンプラズマ発光分光装置に試料溶液を導くために使用し た一方法は、気体圧力式の噴霧器による液体エアロゾル の噴射に基づいた。試料は水溶液を作るために加水分解 され、これが分析された。エアロソル法よりもいくらか 進歩した別の方法は典型的な (exponential) 希釈であ り、これにおいては、試験すべき化合物の試料がアルゴ ンを満たしたフラスコ内で気化され、次いでアルゴン中 c) 加熱されたアルゴン流がプラズマへのその流れを統 10 の蒸気はフラスコから移され、フラスコ内へのアルゴン の流れによりプラズマに向けられる。数種の従来技術の 方法の再調査及びそれらの幾つかの利点の検討を米国特 許第4,688,935号に見ることができる。

> 【0005】本発明により、試験すべき液体化合物の希 釈されない試料がアルゴンの高温の流れの中に直接噴射 される。噴射された液体試料は急速に気化し、蒸気を伴 ったアルゴン流は連続的にプラズマのベース、従ってブ ラズマ内に直接流れ込む。液体試料は、これを急速に気 化させる熱を提供する手段を持った管を通って流れてい るアルゴン流内に噴射される。アルゴンは、噴射点に達 するより前に、試料を気化させて選ぶに十分な温度に加 **熱される。液体試料は、試料がプラズマに達するより前** に、アルゴンと管の周囲壁とからの熱により、アルゴン 流の中に吸射されると急速に気化される。

【0006】本発明は、金属成分を決定するために、揮 発性有機金属液の誘導結合型アルゴンプラズマ発光分光 法による分析に使用できる。これは、例えばトリメチル ガリウム及びトリメチルアルミニウムのような液体有機 金属製品の微量の金属不純物の検出に特に有用である。 誘導結合型アルゴンプラズマ発光分光法により検出され 測定される金属はAl、Si、Ge、Zn、Sn、Hg、P b、Fe、Mn、Ni、Sb及びTeを含む。本発明は従来技 術の方法により行なわれたものより大量の試験試料のプ ラズマへの供給を維持しうるので、本発明は従前より低 い検出限界で試験試料中の不純物を検出し測定する分析 を可能とする。

【0007】本発明は、特別の例及び図面を参照し、よ り詳細に説明されるであろう。 サーモ・ジャレル・アッ シュ(Thermo Jarrel Ash) I CAP-6 1 誘導結合型 すべき化合物の気化された試料を運ぶアルゴン流が分光 40 アルゴンプラズマ発光分光計が分析に使用される。 IC AP-61は、放射源として誘導結合型高周波プラズマ を使用した直読式の電子放出システムである。 ICAP - 61の一般使用の原理及び作動理論は公知であり、こ こでは説明されないであろう。JCAP-61放出シス テムにおいては、抽気された光路転送管が試料採収シス テムと測定システムとを物理的に分離する。測定システ ムは、プラズマ中の材料から放射される光のみを測定す る。本発明はプラズマシステムへの試料採取にのみ関連 し、従って公知の測定システムはより詳細には説明され

【0008】図面において、図1は、アルゴン流の加熱 及びアルゴン流内への試料の噴射と気化とを行う装置の 図式的な図である。この装置においては、試料供給流は プラズマに導かれるように作られる。図2は、図1に示 された加熱及び試料噴射装置からプラズマトーチへの移 動中における試料供給流の温度を維持する管のヒーター を図示する。図3は、トーチ内の試料供給流を示すプラ ズマトーチの図式的線図である。

【0009】図1を参照すれば、アルゴン加熱及び試料 噴射装置は、電気抵抗式の加熱用ロッド12で加熱され 10 る加熱用プロック11を貫通して延びる加熱管10を備 える。加熱管はプロックから外に延び、隔壁キャップ1 3によりその外側端部で閉鎖される。加熱管10の内側 で、試料供給管14がその解放端部を隔壁の直ぐ近くに して、加熱管の加熱用ブロックと同心でその内側部分の 長さを通って延びる。更に、試料供給管は加熱用ブロッ クからプラズマトーチまで連続する。試料供給管の外径 は加熱管の内径より小さく、アルゴン流路用として両方 の管の間の環状流路を形成する。プロック内側の加熱管 の端部近くでアルゴン供給管15が加熱管内部に連結さ 20 れ、アルゴン供給のため加熱用プロックから外に延び る。加熱用ブロック内の加熱管の端末は環状の取り付け 具16に連結され、この取り付け具は加熱管の内側を閉 鎖し更にプロックの壁を貫通して外に延びる。試料供給 管14は環状の取り付け具16の中央を通り更に気密用 のリングとガスケット17とを通って加熱管の内側から 延びる。前記リングとガスケットは供給管を正しい位置 に保持しかつ両管の間の環状の流路の端部を密閉する。 アルゴンは供給管から環状流路を通り加熱管の隔壁端部 の方に流れる。

【0010】加熱管の隔壁端部の内側には、隔壁キャッ プ13と供給管14との間に小さな空間が形成され、ア ルゴンは環状流路からこの小空間を経て供給管の閉口端 の中に流入できる。試験すべき液体試料の入った注入器 18は噴射針19を持ち、この針はアルゴン流のある管 の外部の注入器から延びて隔壁キャップを通り供給管の 開口端に入り、供給管内部でかつ加熱管より下流の点に 至る。針の端部には、供給管の内側に、ポリテトラフル オロエチレン・ウール又は金属繊維若しくは金属線の小 さな緩い束が置かれ、針の端部からの液の飛散を防止す 40 る。さもなければ噴射された液体は小滴として溜まるで

【0011】説明されたアルゴン加熱及び試料噴射装置 においては、分析すべき液体試料はプラズマに導かれる 準備のためアルゴンのキャリヤーガス内に気化される。 加熱用プロック内の電気抵抗式ヒーターが加熱管に熱を 供給し、かつ加熱管の壁温を選定された温度に維持する ように脚盤される。アルゴンガス流は、アルゴン供給管 を通り、加熱管と試料供給管との間の環状流路内に供給

とき、高温の管壁と接触して加熱される。加熱されたア ルゴンは、環状流路の端部からその流れを継続して試料 供給管の開口端内に流入する。注入器内の液体試料が一 定の流量で噴射針を通り、試料供給管を通って連続的に 流れている加熱アルゴン流内に連続的に導入される。噴 射された液体試料は、高温アルゴンガスと管壁とからの 熱により、急速に加熱され試料供給管内で気化される。 高温アルゴン流は試料蒸気を供給管を通って分析用のブ ラズマトーチに選ぶ。

【0012】試料供給管は加熱及び噴射装置からプラズ マトーチまで連続する。噴射点から下流、特に加熱用ブ ロックとプラズマトーチとの間の供給管の部分は、蒸気 の凝結を防止するために蒸気を含んだガスの温度を維持 することが必要なときは加熱することができる。

【0013】図2を参照すれば、試料供給管14の図1 に示された加熱用プロックから図3に示されたプラズマ トーチに延びている部分は、電気抵抗で加熱されるフレ キシブルリポン21で包まれ、更に包まれた管は電気抵 抗で加熱される円筒22内に収容される。リポン21は その抵抗加熱用手段と接続する電線23に接続された電 源(図示せず)により加熱される。加熱される円筒22は 2個の金属半円筒2.4を備え、各半円筒はその各の内部 の重気抵抗棒2.4により加熱される。2個の半円筒はリ ボンの周囲に適合し、かつ供給管を囲むように互いに押 し付けられる。リポン及び円筒内の抵抗式ヒーターへの 電力は、図示されないサーモスタット制御手段により、 供給管内の選定された温度を維持するように調整され

【0014】試料供給管は図3に示されたプラズマトー チに連続する。ボールジョイントは、供給管14の広が った端部とプラズマトーチの試料供給通路31との間に びたりと適合するガラスボールを備える。試料蒸気を運 ぶ加熱アルゴンガスは、供給管14からガラスポール内 の通路を通り試料供給路31内に流れる。この流路31 は、アルゴンガラスをトーチを通ってプラズマに導く。 トーチは、プラズマへの試料供給路の他に、高温プラズ マ34を作るために高周波誘導発生器(高周波コイル)3 3によりトーチ内で加熱されるアルゴンプラズマガスを 供給する別のプラズマガス通路32を備える。高温プラ ズマにおいて、試料化合物は還元され、金属原子は分析 器により検出され測定される特性放射を出す。トーチ は、プラズマを囲む低温ガスの外囲の形成に向けられる 補助的なアルゴンガス流の通る別のアルゴン通路35を

【0015】液体製品中の微量成分を分析するための説 明された装置の作動は、トリメチルガリウム及びトリメ チルアルミニウム製品の分析を引用し説明されるである う。これらは、電子部品の製造用として空気及び水から 保護されねばならない液体化合物であり、作られた化合 される。アルゴンは、ガスが環状流路を通過して流れる 50 物は極めて純粋でなければならない。本発明は、空気及

(4)

特開平4-216440

び水が完全に除外され、かつプラズマに供給されるガス 中に試料が比較的高濃度で噴射されるため、これらの液 体原料の分析に特に有利である。プラズマに供給される 試料中の試験物質の濃度が高いため、従来の方法で達し た最低検出限界より相当に低い検出限界で金属不純物を 分析できる。

5

【0016】分析用のICAP-61分析装置を校正す るには、既知量の不純物を含んだ試験化合物、例えばト リメチルガリウム又はトリメチルアルミニウムの標準液 を使用することが好ましい。金属不純物の液体化合物が 10 揮発性でありかつ試験すべき液体化合物と相溶性である ときは、分析用の既知の組成の標準液を作るために単純 に液体を混合することができる。

【0017】例えば、トリメチルガリウム中のSi、Ge 及びSnの検出及び測定のために分析装置を校正するに は、標準液はトリメチルガリウム中の測定された量のテ トラエチルシリコン、テトラメチルゲルマニウム及びテ トラメチルすずで調製される。

[0018]

【実施例1】以上説明され図面に示された装置が組み立 20 てられる。加熱用プロック内の試料供給管及びアルゴン 通路は完全に清浄にされ、試料供給管はボールジョイン トにおいてICAP-61分析装置のトーチに接続され る。加熱用要素は送電され、ライン温度を93℃に維持 するように調製される。プラズマが点火され、高周波コ イルへの電力 1.5 0 kW、プラズマガス流へのアルゴン 流量18 1/min、補助ガス流へ1.1 1/min、及び試 料ガス流へのアルゴン流量 0.65 l/minで運転され る。公知の手順により分析装置が描かれかつトーチの垂 直方向位置が最適化された安定運転に達するように、ト 30 ーチはこれらの流量で少なくも30分間運転される。ト リメチルガリウム中のテトラエチルシリコン、テトラメ チルゲルマニウム及びテトラメチルすずより標準液が作 られている。この液はGel3μg/ml、Snl6μg/ml 及びSillμg/mlまでの含有量で作られた。

【0019】分光計の校正には、まず純液体トリメチル ガリウムの試料が注人器内に入れられ 0. 1 ml/minの割 合で試料供給管内に噴射される。試料供給管内の加熱ア ルゴンガスの連続流がトリメチルガリウムを気化し、そ の蒸気をトーチに運ぶ。プラズマからの発光が分析装置 により監視され、分析装置によりゲルマニウム、すず及 びシリコンの特性波長における強度が測定される。各波 長における多数の強度測定値が各波長に対して自動記録 され平均化される。次いで試料供給管が外され、上述の 標準液の入った新しい注入器が使用され、前と同様に使 用供給管内に標準液が噴射される。再び各金属に対する 波長における強度が数回測定され平均される。各試料に ついての既知の金属含有量と2種の試料の各について測 定された各金属に対する波長における平均強度とが、各

される.

【0020】トリメチルガリウムの試験用試料が噴射さ れ同じ手順で分析されたとき、シリコン、ゲルマニウム 及びすずに対する波長の各で測定された強度が各金属の 校正曲線と比較され、試験された試料内の不純物として 検出された各金属の量を決定する。

【0021】トリメチルアルミニウム中の不純物測定に ついての分析装置の校正及び使用に関しては、試料溶液 はトリメチルガリウムの代わりにトリメチルアルミニウ ムを使用する点を除いて同じ方法で作られ使用され、加 熱はトリメチルアルミニウムの分析については賦料供給 管内のライン温度をより高温、約212℃に維持するよ うに調整される。分析装置は、校正用としてトリメチル ガリウム又はドリメチルアルミニウムにおけるその他の 金属の液体化合物の溶液を使用し、そのようなその他の 金属の分析のため、同じ方法で校正しうる。

【0022】校正に使用される化合物が単一の溶液と不 相溶性であるときは、化合物を説明された種類の別々の 加熱装置内で各を別個にアルゴン流内に噴射し気化さ せ、次いで蒸気を流れの中で一緒にトーチに運ぶことが できる。例えば、上述の種類の2個の加熱装置は、第1 の加熱装置からのアルゴン流が第2の加熱装置のアルゴ ン流の入り口に直接向けられるようにして直列に連結さ れる。不純物金属の液体化合物の測定された量が第1の 加熱装置においてアルゴン内に一定流量で噴射され気化 され、蒸気はアルゴン流により第2の加熱装置に運ば れ、ここで第2の液体の測定された量が同じアルゴン流 内に一定流量で噴射され気化され、次いで両者の蒸気が トーチに運ばれる。

【0023】この方法で、例えばシメチルセレナイト、 1-プチルアルシン、ジメチルカドミウム、又はジエチ ルスルフィドのような化合物を第1の加熱装置において アルゴン中に気化し、アルゴン流中で第2の加熱装置を 通過させ、ここでトリメチルガリウム又はトリメチルア ルミニウムが気化され、流れはプラズマトーチに前進す

【0024】説明された試料供給の装置及び方法を使用 する誘導結合型アルゴンプラズマ発光分光法による校正 及び分析では、トリメチルガリウムの直接噴射速度 0. 1 ml/minでのプラズマへのガリウムの供給速度は、ガ リウムの供給速度約1100μg/secに相当する。対照 的に、噴霧器により供給されるガリウム化合物の2%水 溶液を使用したプラズマへの代表的なガリウム供給速度 は、ガリウム供給速度約8g/secに相当する。典型的 な (exponential) 希釈法によるトリメチル ガリウムについての代表的な供給速度はガリウム約1μ g/secに相当する。本発明によりプラズマへの有機金属 化合物の供給速度を何桁も大きくできるので、化合物中 の金属不純物の検出の限界を典型的には l ppm以下、大 金属についての強度対適度の校正曲線を描くために使用 50 多数の金属に対しては 0.05 から 0.3 ppmの範囲に低

(5)

特閖平4-216440

下できる。

【0025】木発明の装置及び方法は、その他の通気金属製品をごく低濃度の金属不純物について分析するために使用できる。例えば、モノターシャリーブチルアルシン製品 (monotertiary butyl arsine products) をシリコン、りん及びその他の金属不純物1ppm以下の限度で分析できる。例えば、モノターシャリーブチルフォスフィン、ジイソプロビルテルル、ジメチルカドミウム、ジメチルシンク及び類似物を含んだその他の製品を分析することができる。

7

【0026】本発明の実施態様につき説明すれば次の通りである。

[0027]

- 1. 揮発性有機金属化合物内の金属不純物を検出し測定 する誘導結合型アルゴンプラズマ発光分光の手段による 前記化合物の分析において、
- a) 分光計の誘導結合型アルゴンプラズマにアルゴン流 を連続的に供給し、
- b) 前記アルゴン流がプラズマに達するより以前に、分析すべき有機金属化合物の気化した試料を流れの中で運ぶに十分な温度にこれを加熱し、
- c) 加熱されたアルゴン流がプラズマへのその流れを続けているときに、分析すべき化合物の液体試料を加熱されたアルゴン流内に直接噴射し、
- d) アルゴン流がプラズマに達するより前に加熱され流れているアルゴン流内で噴射された試料を気化させ、
- e) 気化試料を分析用プラズマに直接運ぶ加熱アルゴン 流の流れを連続することを包含した改良。

[0028]

2. 前記揮発性有機金属液体化合物がトリメチルガリウ 30 ムである上記1により定められた方法。

[0029]

3. 前記揮発性有機金属液体化合物がトリメチルアルミニウムである上配1により定められた方法。

[0030]

4. 光源としての誘導結合型高周波プラズマ及び分析すべき揮発性液体化合物の気化試料をプラズマ内に導く手段を備えた誘導結合型アルゴンプラズマ発光分光装置にして、前記手段が

- a) 前記プラズマ内にアルゴンの連続流を流すための手段
- b) 前記アルゴンの流れがプラズマに達するより前に前 記流れを加熱するための手段、
- c) 揮発性液体の鼠料を加熱アルゴン流内に連続的に噴 10 射するための手段、及び
 - d) アルゴン流がプラズマに達するより前に前記液体を 前記アルゴン流内に気化させる手段を具備した装置。

[0031]

5. アルゴン流を加熱するための前配手段が、電気抵抗 式ヒーターにより加熱される加熱用の管を備える上配4 により定められた装置。

[0032]

6. 液体試料を加熱アルゴン流内に連続的に噴射する前 記手段が、アルゴン流を流す管の外部の注入器、及び注 7 入器から隔壁を通って加熱管より下流のアルゴン供給管 内の噴射点に至る噴射針を備える上記5により定められ た装置。

【00,33】7. 気化した試料を運ぶアルゴン流を蒸気の凝結防止に十分な温度に維持するために噴射点より下流でアルゴン供給管を加熱する手段を更に備えた上記4に定められた装置。

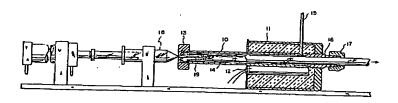
【図面の簡単な説明】

【図1】アルゴン流の加熱及びアルゴン流内への試料の 噴射と気化を行う装置の図式的な図である。

【図2】図2は、図1に示された加熱及び試料噴射装置 からプラスマトーチへの移動中における試料供給流の温 度を維持する管のヒーターを図示する。

【図3】トーチ内に試料供給流を示すプラズマトーチの 図式的線図である。

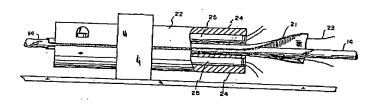
[図1]



(6)

特開平4-216440





[図3]

